(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2004年5月13日(13.05.2004)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2004/040282 A1

(51) 国際特許分類7:

G01N 22/00

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2003/013703

(22) 国際出願日:

2003年10月27日(27.10.2003)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ: 特願 2002-316770

2002年10月30日(30.10.2002) JP

- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式 会社ニチレイ (NICHIREI CORPORATION) [JP/JP]; 〒104-8402 東京都 中央区 築地 6 丁目 1 9番 2 0 号 Tokyo (JP). 学校法人東海大学 (TOKAI UNIVERSITY) [JP/JP]; 〒151-0063 東京都 渋谷区 富ヶ谷 2 丁目 2 8番 4号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 井上 敏文 (IN-OUE, Toshifumi) [JP/JP]; 〒273-0005 千葉県 船橋市

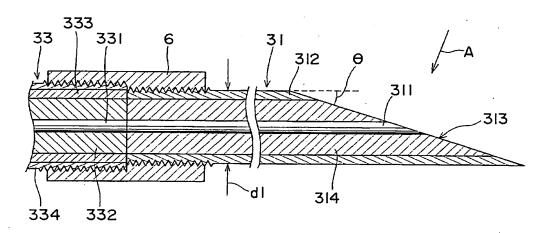
本町 4-4-8-201 Chiba (JP). 八木原 晋 (YAGI-HARA,Shin) [JP/JP]; 〒254-0914 神奈川県 平塚市 高村 203-13-304 Kanagawa (JP). 新屋敷 直木(SHINYASHIKI,Naoki) [JP/JP]; 〒258-0001 神奈川県足柄上郡 松田町寄1531番地4 Kanagawa (JP).

- (74) 代理人: 村瀬 一美, 外(MURASE,Kazumi et al.); 〒 105-0003 東京都港区 西新橋2丁目12番7号西新橋立川ビル別館 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許

[続葉有]

(54) Title: PROBE FOR PHYSICAL PROPERTIES MEASUREMENT

(54) 発明の名称:物性測定用プローブ



(57) Abstract: A probe (31) has an internal electrode (311) and an external electrode (312) and is used in a physical properties measurement system wherein a complex dielectric constant of an object of measurement is measured and values of physical properties of the object, among which the moisture content is the typical, are determined according to the measured complex dielectric constant. In order to accurately measure the complex dielectric constant whether the surface of the object is rough or not and to have an appropriate electrical length, the probe is provided with an end face (313) which is inclined to the axis of the internal electrode (311)

(57) 要約: 本発明は、被測定物の複素誘電率を測定し、測定された複素誘電率に基づいて被測定物の含水量に代表される物性値を測定する物性測定装置に用いられ、内部電極(311)と外部電極(312)とを有するプローブ(31)に関し、被測定物表面の凹凸の有無にかかわらず正確に複素誘電率の測定を行うと共に適切な電気長に設定するために、内部電極(311)の軸方向に対して斜めに端面(313)を形成している。



C&CUVU/VU



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

2 6 APR 2000

International application No. CT/JP03/13703

A.	CLASSIFICA	TION O	F SUE	JECT	MATTER	L
	Int. C17	G01N	22/0	าด		

Int.C1 ⁷ G01N22/00	71 17K	10	/532688	
According to International Patent Classifica	ntion (IPC) or to both nati	ional classification and IPC		
B. FIELDS SEARCHED				
Minimum documentation searched (classification Int.Cl ⁷ G01N22/00-22/	'04, G01R27/00-	-27/32, G01N27/00-27/		
Documentation searched other than minimu	ım documentation to the	extent that such documents are includ	ed in the fields searched	
Jitsuyo Shinan Koho				
Electronic data base consulted during the in JICST FILE (JOIS)	nternational search (name	e of data base and, where practicable, s	search terms used)	
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BI	E RELEVANT			
Category* Citation of document, w	ith indication, where app	propriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.	
Y JP 2740528 B2 (23 January, 1998 Full text; all ((Family: none)	3 (23.01.98),	ity),	1-4	
to the request o No. 78565/1989(I (Denki Kagaku Ke 21 February, 199	Microfilm of the specification and drawings annexed to the request of Japanese Utility Model Application No. 78565/1989(Laid-open No. 17554/1991) (Denki Kagaku Keiki Kabushiki Kaisha), 21 February, 1991 (21.02.91), Full text; all drawings (Family: none)		d 1-4	
Further documents are listed in the c	ontinuation of Box C.	See patent family annex.		
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance earlier document but published on or after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document of particular relev			th the application but cited to underlying the invention the claimed invention cannot be sidered to involve an inventive lone the claimed invention cannot be step when the document is such documents, such erson skilled in the art	
Date of the actual completion of the internation 22 January, 2004 (22.		Date of mailing of the international s 03 February, 2004		
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Offic	ce	Authorized officer		

Telephone No.

Facsimile No.



Int onal application No.
PCT/JP03/13703

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.	
Y	Microfilm of the specification and drawings annexed to the request of Japanese Utility Model Application No. 137987/1986(Laid-open No. 47261/1988) (Kabushiki Kaisha Casio BOC), 30 March, 1988 (30.03.88), Full text; all drawings (Family: none)	1-4	
Y	JP 8-159990 A (Kao Corp.), 21 June, 1996 (21.06.96), Full text; all drawings (Family: none)	2,3	
Y	CD-ROM of the specification and drawings annexed to the request of Japanese Utility Model Application No. 46129/1992 (Laid-open No. 2218/1994) (Kabushiki Kaisha Sanko Denshi Kenkyusho, Shinko Denki Keiso Kabushiki Kaisha), 14 January, 1994 (14.01.94), Par. Nos. [0011] to [0013]; Figs. 1, 2 (Family: none)		
Y	JP 10-142169 A (Kao Corp.), 29 May, 1998 (29.05.98), Par. No. [0040] (Family: none)	4	
A	JP 8-320297 A (Kao Corp.), 03 December, 1996 (03.12.96), Full text; all drawings (Family: none)	1-4	
,	•		



国際出願番号 PCT/JP03/13703

					
A. 発明の履	属する分野の分類(国際特許分類(IPC))				
Int. C	1' G01N 22/00				
B. 調査を行	これ 公野				
	けったカガ 最小限資料(国際特許分類(IPC))				
Int. C	1' G01N 22/00-22/04, G G01N 27/00-27/24	01R 27/00-27/32			
最小限資料以夕	トの資料で調査を行った分野に含まれるもの				
日本国実用	新客公報 1922-1996年				
	実用新案公報 1971-2003年				
	実用新案公報 1994-2003年				
日本国実用	新案登録公報 1996-2003年				
国際調査で使用	目した電子データベース (データベースの名称、	調査に使用した用語)	`		
JICST	「ファイル (JOIS)	,			
C. 関連する	5と認められる文献				
引用文献の	- CHR. O. CHR.		関連する		
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連すると	きは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号		
Y	JP 2740528 B2 (学校法人東	海大学)	1-4		
_	1998.01.23,全文,全図(ファ				
	,		'		
Y	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	· (日本国実用新案登録出願公開3	1-4		
-	-17554号)の願書に添付した明細書				
f	ロフィルム(電気化学計器株式会社)				
ŀ	1991.02.21,全文,全図(ファ	ミリーかし)			
x C欄の続き	きにも文献が列挙されている。	□ パテントファミリーに関する別	紙を参照。		
* 引用文献	のカテゴリー	の日の後に公表された文献			
「A」特に関i	車のある文献ではなく、一般的技術水準を示す	「T」国際出願日又は優先日後に公表			
	もの出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論				
「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 の理解のために引用するもの					
以後に公表されたもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの					
日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以					
文献(理由を付す) 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに					
「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献よって進歩性がないと考えられるもの					
「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 「&」同一パテントファミリー文献					
国際調査を完	了した日 22.01.2004	国際調査報告の発送日	. 2004		
ļ					
国際調査機関の名称及びあて先 特許庁審査官(権限のある職員) 2W 300					
日本国特許庁(ISA/JP) 平田 佳規 平田 佳規 平田 佳規					
	郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 電話番号 03-3581-1101 内線 3290				
1	No. 1 facatembries between the angle of				



国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP03/13703

C (4± ± 1	明油ナスし刻めたわる女部	
C (続き).	関連すると認められる文献 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
<u>カテゴリー*</u> Y	日本国実用新案登録出願61-137987号(日本国実用新案登録出願公開63-47261号)の願書に添付した明細書及び図面の内容を撮影したマイクロフィルム(株式会社カシオビーオーシー)1988.03.30,全文,全図(ファミリーなし)	1-4
Y	JP 8-159990 A (花王株式会社) 1996.06.21,全文,全図 (ファミリーなし)	2, 3
Y	日本国実用新案登録出願4-46129号(日本国実用新案登録出願公開6-2218号)の願書に添付した明細書及び図面の内容を記録したCD-ROM(株式会社サンコウ電子研究所,信光電気計装株式会社)1994.01.14,【0011】~【0013】段落,第1、2図(ファミリーなし)	3
Y	JP 10-142169 A (花王株式会社) 1998.05.29,【0040】段落(ファミリーなし)	4
A	JP 8-320297 A (花王株式会社) 1996.12.03,全文,全図 (ファミリーなし)	1-4